

**Bundesamt für Strahlenschutz
Bekanntmachung gemäß § 11 Röntgenverordnung (RöV)**

5. Nachtrag zur Bauartzulassung He/Rö/V3 23/95

vom 11. Dezember 2003

Gemäß §§ 8 ff. RöV in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) wird die Bauartzulassung He/Rö/V3 23/95, erteilt am 21.09.1995 durch das Regierungspräsidium Kassel mit den Nachträgen 1 bis 4 geändert:

Bezeichnung der Vorrichtung: Röntgendiffraktometer als Vollschutzgerät
Wafer-Analyzer/X'PERT PRO

Bisheriger Zulassungsinhaber: Philips Analytical
Unternehmensbereich der Philips GmbH
Miramstr. 87, 34123 Kassel

Die Zulassung wird wie folgt geändert:

1. Umfirmierung

Zulassungsinhaber PANalytical GmbH
Miramstr. 87
34123 Kassel

Hersteller der Vorrichtung PANalytical B.V., Lelyweg 1, NL 7602 EA Almelo,
Niederlande

2. Änderungen der Probenzufuhr

Das Probenhandling der Vorrichtung wurde für neue Probenarten sowie automatische Beladevorgänge ausgelegt. Dazu änderte sich die Position der Röntgenröhre innerhalb des Röhrenschutzgehäuses („Strahlungshaube“). Außerdem wurde die Konstruktion der Proben-Beladung im hinteren Teil der Vorrichtung geändert: Die beweglichen Teile der Türöffnungen wurden schmaler ausgeführt, hinzu kam ein verschraubbares drittes Teil – je nach Ausführung als Verschluss-Schieber oder Blindflansch ausgelegt.

Dieser Nachtrag gilt nur im Zusammenhang mit der o.g. Bauartzulassung und den hierzu ergangenen Nachträgen.

Salzgitter, den 11.Dezember 2003
57502/2-008

Bundesamt für Strahlenschutz
Im Auftrag

Czarwinski